

MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH TERRA AFM



INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. +48 364 42 41, fax +48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

Mikroskop TERRA AFM przeznaczony jest do badań naukowych, przemysłowych oraz do nauczania podstaw nanotechnologii w szkołach wyższych. Składa się z trzech części: głowicy pomiarowej, pulpitu operatorskiego przeznaczonego głównie dla wspomagania regulacji mikroskopu oraz bloku elektroniki umieszczonego w kasecie z magistralą VME.

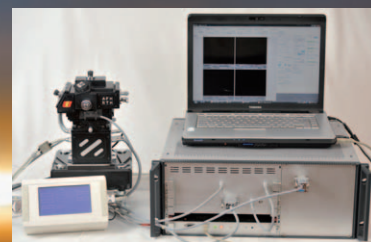
Przyrząd charakteryzuje się prostotą i wygodą obsługi osiągniętą przez zastosowanie:

- podglądu procesu zbliżania na opcjonalnym monitorze TV, w dużym powiększeniu,
- podglądu procesu regulacji mikroskopu na monitorze PC oraz na ciekłokrystalicznym ekranie panelu operatorskiego,
- wspomagania sprzętowego i programowego procesu wstępnego zbliżania.

Zakresy skanowania w osi x, y:	12 μm z rozdzielczością 0,3 nm (rurka 1"), 50 μm z rozdzielczością 1 nm (rurka 2")
Zakresy skanowania w osi z:	2,5 μm z rozdzielczością 0,05 nm (rurka 1"), 6 μm z rozdzielczością 0,1 nm (rurka 2")
Zdolność rozdzielcza w trybie AFM na graficie:	widoczne monoatomowe uskoki warstw
Rozdzielczość skanowanych obrazów:	256x256 z 16-bitową precyzją skanowania
Szybkość skanowania z rozdzielczością 256x256 linii obrazu:	180 sekund
Zakres pozycjonowania wstępnego:	x: 10 mm, y: 10 mm, z: 8 mm
Typ skanera:	piezoelektryczny rurkowy, wymienny
Możliwości rozbudowy:	opcje: MFM, EFM, LFM, CITS, SRM, SCM, KPM, mod kontaktu przerywanego, analiza harmonicznych drgań sondy



Głowica mikroskopu TERRA AFM



Zestaw mikroskopu TERRA AFM

KONTAKT

Zespół Marketingu
innowacje@itee.radom.pl
tel.: 48 36 49 211
fax: 48 36 44 749



Innowacyjne Systemy Wspomaganie Techniczne
Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki

PROPOZYCJA MARKETINGOWA

➤ sprzedaż produktu

